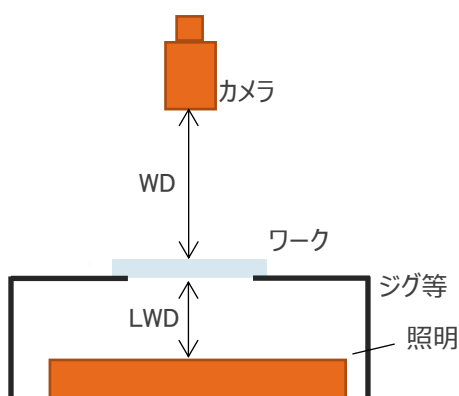
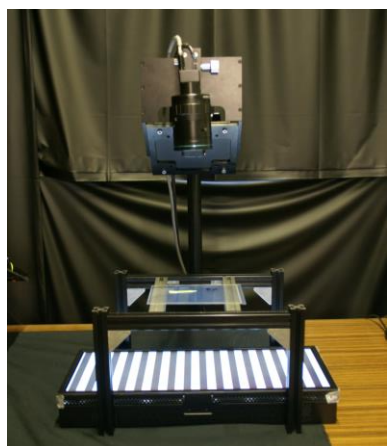


参考資料 表面欠陥検査ユニット SSMM-1 「透過式検査方法について」

概要

鏡面や透明な表面を持つ製品の表面状態を、明暗のスリットにより強調しブツヘコ異物の検査を行う「表面欠陥検査ユニット SSMM-1」について、透過式の検査方法を透明パネルの検査を例にご紹介します。検査対象が透明な場合は、透過式検査方法で凹凸、異物の検査が可能です。ただし、透過式では比較的ゆるやかで浅い凹凸の検査はできません。どの程度のゆるやかさまで検出できるかは表面の状態によりさまざまです。弊社では御社サンプルの無償検証を承っております。

光学条件



スリット照明の上にジグ等を用いてワークを照明から LWD[mm]の位置に離して配置します。その上にカメラを WD[mm]離して配置し検査を行います。

条件

WD : 210 mm

LWD : 120 mm

レンズ絞り : F 値 8

視野 : 96 x 60 mm

画素 : 1920 x 1200 ピクセル

撮影例 (凹凸・異物)

下記に凹凸と異物の欠陥サンプルを検査した結果を記載します。スリット照明により欠陥が強調され、欠陥位置が特定できています。面照明で撮影した場合は凹凸の欠陥の強調が来ていません。

欠陥サンプル	スリット撮影画像	欠陥強調画像	検出結果	面照明で撮影した場合
凹凸 欠陥サイズ 直径 1.0 mm				
異物 欠陥サイズ 直径 0.5 mm				